

Modul: Computergestützte Messtechnik

Niveau	Bachelor	Kürzel	CMT
Modulname englisch	Computer based measurements		
Modulverantwortliche	Abke, Jochen, Prof. DrIng.		
Fachbereich	Elektrotechnik und Informatik		
Studiengang	Allgemeine Elektrotechnik, Bachelor		
Verpflichtungsgrad	Wahl	ECTS-Leistungspunkte	5
Fachsemester	(Nicht festgelegt)	Semesterwochenstunden	4
Dauer in Semestern	1	Arbeitsaufwand in Stunden	150
Angebotshäufigkeit	(Flexibel)	Präsenzstunden	60
Lehrsprache	Deutsch	Selbststudiumsstunden	90
Der folgende Abschnitt ist nur au	usgefüllt, wenn es gen	au eine modulabschließende Pr	üfung gibt.
Prüfungsleistung	Mündliche Prüfung	Prüfsprache	Deutsch
Dauer PL in Minuten	30	Bewertungssystem PL	Drittelnoten
		ufbau und die Einsatzmöglichkeit utzten Messplätzen in den Bereic	
	Qualitätskontro können serielle Sensoren und können den Au computergestü können die Eig computergestü können Methol aus der digitale erfassen, visua können ein Pro		chen Entwicklung, m Anschluss von en. ner Hardware zur beschreiben. analysieren. f eine Anwendung
Teilnahmevoraussetzungen	Qualitätskontro können serielle Sensoren und können den Au computergestü können die Eig computergestü können Methol aus der digitale können digitale erfassen, visua können ein Pro (Device Under	atzten Messplätzen in den Bereichelle und Fertigung erläutern. Der und parallele Schnittstellen zur Geräten an Computer analysiere ufbau und die Funktionsweise ein atzten Erfassung von Messdaten genschaften einer Hardware zur atzten Erfassung von Messdaten den der Softwareentwicklung auf messtechnik anwenden. Der und analoge Messdaten mit ein alisieren und analysieren. Degramm zum automatisierten Ter Test) mit LabVIEW entwickeln.	chen Entwicklung, m Anschluss von en. ner Hardware zur beschreiben. analysieren. f eine Anwendung nem Computer st eines DUT
Der vorige Abschnitt ist nur ausg	Qualitätskontro können serielle Sensoren und können den Au computergestü können die Eig computergestü können Methor aus der digitale können digitale erfassen, visua können ein Pro (Device Under	itzten Messplätzen in den Bereichelle und Fertigung erläutern. er und parallele Schnittstellen zur Geräten an Computer analysiere ufbau und die Funktionsweise ein itzten Erfassung von Messdaten genschaften einer Hardware zur itzten Erfassung von Messdaten den der Softwareentwicklung auf en Messtechnik anwenden. er und analoge Messdaten mit ein alisieren und analysieren. Er Test) mit LabVIEW entwickeln.	chen Entwicklung, m Anschluss von en. ner Hardware zur beschreiben. analysieren. f eine Anwendung nem Computer st eines DUT ne (z.B. C) ung gibt.
Der vorige Abschnitt ist nur ausg Berücksichtigung von	Qualitätskontro können serielle Sensoren und können den Au computergestü können die Eig computergestü können Methor aus der digitale können digitale erfassen, visua können ein Pro (Device Under Kenntnisse in einer s gefüllt, wenn es genau Verwendung ges	itzten Messplätzen in den Bereichelle und Fertigung erläutern. Der und parallele Schnittstellen zur Geräten an Computer analysiere ufbau und die Funktionsweise ein itzten Erfassung von Messdaten genschaften einer Hardware zur itzten Erfassung von Messdaten den der Softwareentwicklung auf en Messtechnik anwenden. Der und analoge Messdaten mit ein alisieren und analysieren. Der anstelle und analysieren der Test) mit LabVIEW entwickeln.	chen Entwicklung, m Anschluss von en. ner Hardware zur beschreiben. analysieren. f eine Anwendung nem Computer st eines DUT ne (z.B. C) ung gibt. L-Standard)
Der vorige Abschnitt ist nur ausg	Qualitätskontro können serielle Sensoren und können den Au computergestü können die Eig computergestü können Methor aus der digitale können digitale erfassen, visua können ein Pro (Device Under Kenntnisse in einer s gefüllt, wenn es genau Verwendung ges	itzten Messplätzen in den Bereichelle und Fertigung erläutern. er und parallele Schnittstellen zur Geräten an Computer analysiere ufbau und die Funktionsweise ein itzten Erfassung von Messdaten genschaften einer Hardware zur itzten Erfassung von Messdaten den der Softwareentwicklung auf en Messtechnik anwenden. er und analoge Messdaten mit ein alisieren und analysieren. Er Test) mit LabVIEW entwickeln.	chen Entwicklung, m Anschluss von en. ner Hardware zur beschreiben. analysieren. f eine Anwendung nem Computer st eines DUT ne (z.B. C) ung gibt. L-Standard)
Der vorige Abschnitt ist nur ausg Berücksichtigung von Gender- und Diversity-	Qualitätskontro können serielle Sensoren und können den Au computergestü können die Eig computergestü können Methor aus der digitale erfassen, visua können ein Pro (Device Under Kenntnisse in einer s gefüllt, wenn es genau Verwendung gest Zielgruppengerec	itzten Messplätzen in den Bereichelle und Fertigung erläutern. Der und parallele Schnittstellen zur Geräten an Computer analysiere ufbau und die Funktionsweise ein itzten Erfassung von Messdaten genschaften einer Hardware zur itzten Erfassung von Messdaten den der Softwareentwicklung auf en Messtechnik anwenden. Der und analoge Messdaten mit ein alisieren und analysieren. Der anstelle und analysieren der Test) mit LabVIEW entwickeln.	chen Entwicklung, m Anschluss von en. ner Hardware zur beschreiben. analysieren. f eine Anwendung nem Computer st eines DUT ne (z.B. C) ung gibt. L-Standard) Methoden

Bemerkungen	Inhaltlich ähnlich zum früheren Modul PC-Messtechnik. Dieses Modul kann
	1:1 anerkannt werden



Lehrveranstaltung: Computergestützte Messtechnik (Vorlesung)

(zu Modul: Computergestützte Messtechnik)

Lehrveranstaltungsart	Vorlesung	Lernform	Präsenz
LV-Name englisch	Computer based measurements (lecture)		
Anwesenheitspflicht	nein	ECTS-Leistungspunkte	2
Teilnahmebeschränkung		Semesterwochenstunden	2
Gruppengröße		Arbeitsaufwand in Stunden	60
Lehrsprache	Deutsch	Präsenzstunden	30
Studienleistung		Selbststudiumsstunden	30
Dauer SL in Minuten		Bewertungssystem SL	
Der folgende Abschnitt ist nur a	usgefüllt, wenn es eine	e lehrveranstaltungsspezifische F	Prüfung gibt.
Prüfungsleistung		Prüfsprache	
Dauer PL in Minuten		Bewertungssystem PL	
Lernergebnisse			
Teilnahmevoraussetzungen			

Der vorige Abschnitt ist nur ausgefüllt, wenn es eine lehrveranstaltungsspezifische Prüfung gibt.

Lehrinhalte

Die Vorlesung ist gleichmäßig aufgeteilt in einen Theorieteil und ein Schulungsteil (mit integrierten Übungen), indem eine Einführung in die Programmierumgebung LabVIEW gegeben wird.

Theorieteil

- Aufbau, Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von computergestützten Messplätzen in den Bereichen Entwicklung, Qualitätskontrolle und Fertigung
- Serielle und parallele Schnittstellen zur Datenerfassung
- Funktionsweise und Bedeutung von Protokollen und Treibern
- Aufbau und Eigenschaften von Multifunktionshardware zur Erfassung von analogen und digitalen Messdaten
- Prozessschritte im Rahmen einer Softwareentwicklung
- Aufbau von verteilten und automatisierten Anwendungen in der digitalen Messtechnik

Schulung LabVIEW (mit integrierten Übungen)

- Einführung in die Datenflussorientierte Programmierung mit LabVIEW und Abfrage von Daten einer Wetterstation über die serielle Schnittstelle
- Einführung in die Entwicklung mit LabVIEW unter Berücksichtigung von Style Guides

	 Erfassung von Messdaten mit Hilfe von Multifunktionshardware über einem Treiber Visualisierung von Messdaten in Abhängigkeit der Zeit Entwurfsmethoden in LabVIEW Formate zur Speicherung von Messdaten Methoden zur Analyse von Messdaten
Literatur	Lerch, Reinhard; Elektrische Messtechnik – Analoge, digitale und computergestützte Verfahren; Springer
Bemerkungen	



Lehrveranstaltung: Computergestützte Messtechnik (Praktikum)

(zu Modul: Computergestützte Messtechnik)

Lehrveranstaltungsart	Praktikum	Lernform	
LV-Name englisch	Computer based measurements (practical course)		
Anwesenheitspflicht	nein	ECTS-Leistungspunkte	3
Teilnahmebeschränkung		Semesterwochenstunden	2
Gruppengröße	12	Arbeitsaufwand in Stunden	90
Lehrsprache	Deutsch	Präsenzstunden	30
Studienleistung	Praktikum	Selbststudiumsstunden	60
Dauer SL in Minuten		Bewertungssystem SL	Bestehen
Der folgende Abschnitt ist nur au	usgefüllt, wenn es eine	e lehrveranstaltungsspezifische F	Prüfung gibt.
Prüfungsleistung		Prüfsprache	
Dauer PL in Minuten		Bewertungssystem PL	
Lernergebnisse			
Teilnahmevoraussetzungen			
Lehrinhalte	 Schrittweise Entwicklung eines automatisierten Programms zum Test eines Gerätes (DUT – Device under Test) Der Test des DUT kann jedes Semester eine andere Aufgabe sein. Beispiel: Untersuchung des Frequenzverhaltens einer Schaltung mittels Bode-Diagramm Automatisierte Kalibrierung eines Sensors Automatisierte Analyse einer Kennlinie in Bezug auf Kennlinienfehler Die gesamte Entwicklung wird in mehrere Einheiten (Schritte) aufgeteilt. An jedem Praktikumstermin bekommen die Studierende eine Teilaufgabe Die Summe der Teilaufgabe ist am Ende das Gesamtprogramm Im Praktikum wird ein Code-Review durchgeführt Im Entwicklungsprozess wird ein Versionsverwaltungstool 		
	 Der Test des Esein. Beispiel: Untersuchung Bode-Diagram Automatisierte Automatisierte Kennlinienfehl Die gesamte Eaufgeteilt. An jedem Prakteilaufgabe Die Summe de Im Praktikum v 	rätes (DUT – Device under Test) DUT kann jedes Semester eine a des Frequenzverhaltens einer S m Kalibrierung eines Sensors Analyse einer Kennlinie in Bezu er Entwicklung wird in mehrere Einh ktikumstermin bekommen die Stu er Teilaufgabe ist am Ende das G wird ein Code-Review durchgefü	andere Aufgabe Schaltung mittels ag auf seiten (Schritte) udierende eine Gesamtprogramm hrt
Literatur	 Der Test des Esein. Beispiel: Untersuchung Bode-Diagram Automatisierte Automatisierte Kennlinienfehl Die gesamte Eaufgeteilt. An jedem Prak Teilaufgabe Die Summe de Im Praktikum verngesetzt 	rätes (DUT – Device under Test) DUT kann jedes Semester eine a des Frequenzverhaltens einer S m Kalibrierung eines Sensors Analyse einer Kennlinie in Bezu er Entwicklung wird in mehrere Einh ktikumstermin bekommen die Stu er Teilaufgabe ist am Ende das G wird ein Code-Review durchgefü	andere Aufgabe schaltung mittels ag auf seiten (Schritte) sudierende eine Gesamtprogramm hrt valtungstool